Atomerő-mikroszkóp és pásztázó alagútmikroszkóp AFM és STM

Készítette: Illés Gergő

2023. április 24.

Tartalomjegyzék

- Atomerő mikroszkópia
 - Történeti áttekintés
 - Elméleti áttekintés
 - Működési üzemmódok
 - Felvételek
- Pásztázó alagútmikroszkóp
 - Történeti áttekintés
 - Elméleti áttekintés
 - Felhasználási lehetőségek
 - Felvételek
- 3 Hivatkozások

Atomerő mikroszkópia - Történeti áttekintés

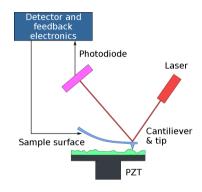
- Pásztázószondás-mikroszkópia
- Abbe-féle diffrakciós limit $d=0,61\frac{\lambda}{N_A}$
- Gerd Binnig, Calvin Quate és Christopher Gerber
- Demonstráció: 1986



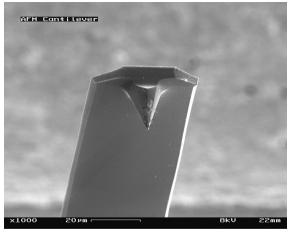
Gerd Binnig

Atomerő mikroszkópia - Elméleti áttekintés

- Laprugó tűvel a végén
- Erőhatások: Coulomb-erő, van der Waals erők
- Piezzo-elektromos mozgatók
- Fotodetektor



AFM sematikus rajza





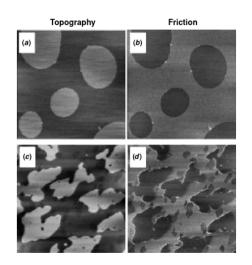
AFM tű elektronmikroszkóp alatt

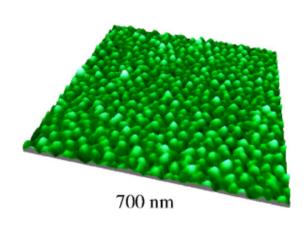
Thorlabs AFM csomag

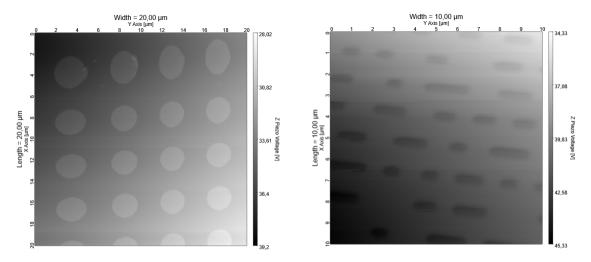
Atomerő mikroszkópia - Működési üzemmódok

- Kontakt mód: hajlékony laprugó, kopás
 - Állandó magasság
 - Állandó meghajlás
- Tapogató mód: rezonanciafrekvencia, kitérés, kisebb mértékű kopás
- Kontakt nélküli mód: távoli erők mérése (van der Waals), legkevesebb degradáció

Atomerő mikroszkópia - Felvételek







Kalibráló minta AFM-hez

CD-ről készült AFM kép

Pásztázó alagútmikroszkóp - Történeti áttekintés

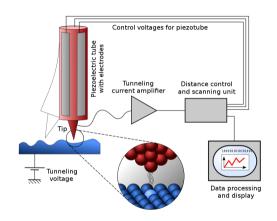
- Pásztázószondás mikroszkópia
- Gerd Binnig, Heinrich Rohrer
- Szabadalom: 1979
- Nobel-díj: 1986



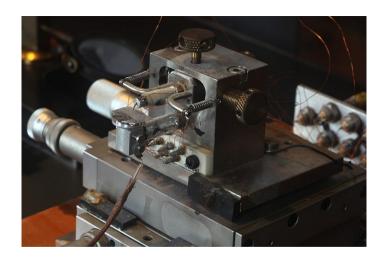
Heinrich Rohrer

Pásztázó alagútmikroszkóp - Elméleti áttekintés

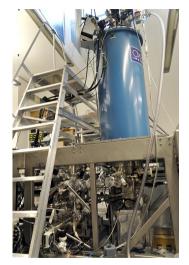
- Amíg az AFM elsősorban mechanikai kölcsönhatást mér az STM az elektron alagutazáson alapszik
- Áramot mérünk a feszültség és a szonda magasságának függvényében
- 100 pm-es felbontás oldalirányban, 10 pm-es mélységi felbontás



STM berendezés vázlata



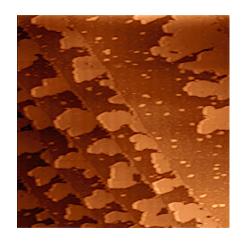
Egyik első működő STM berendezés



Modern STM műszer

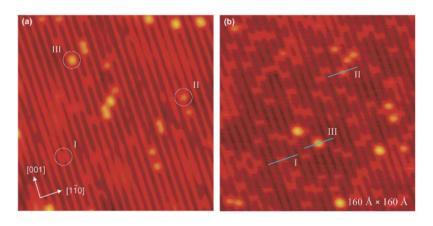
Pásztázó alagútmikroszkóp - Felhasználási lehetőségek

- Finom felületi struktúrák vizsgálata
- Kirstály és molekulaszerkezetek
- Defektusok keresése

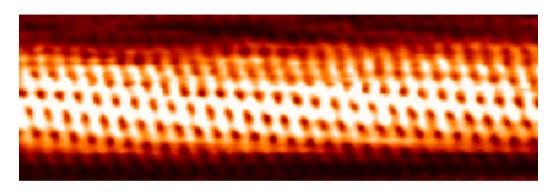


Palládium kristályon növesztett ezüst szigetek

Pásztázó alagútmikroszkóp - Felvételek



Különböző módon kezelt TiO₂ felületek



Szén nanocsövek

Hivatkozások

- [1] https://qd-europe.com/it/en/news/latest-updates/newsdetails/history-and-background-of-atomic-force-microscopy--1807/
- [2] https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=10756/
- [3] Andrea Alessandrini és Paolo Facci: AFM: a versatile tool in biophysics
- [4] https://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/microscope/
- [5] https://www.nist.gov/pml/scanning-tunneling-microscope/scanning-tunneling-microscope-introduction
- [6] S. Wendt et. al: Oxygen vacancies on $TiO_2(1\ 1\ 0)$ and their interaction with H_2O and O_2 : A combined high-resolution STM and DFT study